

NUBIC 知的財産情報開示

開示日：2016年7月12日

各 位

NUBIC 知的財産情報の要約を公開いたします。

技術移転等を御希望の場合は、ホームページの「[NUBIC 技術シーズ案件申込](#)」フォームからお申込みください。各担当コーディネーターから御連絡申し上げます。

「[NUBIC 技術シーズ案件申込](#)」フォーム：

[TOP](#)> [共同・受託研究](#)> [申込書／契約書](#)> [技術移転等をご希望の場合](#)> [WEB](#) から

出願番号 整理番号 担当者

表題	イオン液体を用いた透過型電子顕微鏡による錯体の観察方法及び観察用試料		
発明の用途	電子顕微鏡のアプリケーションとして応用が可能である。		
技術概要	本発明は、金属錯体を電子顕微鏡で観察する際に添加するイオン液体を特定した事、及び取得された観察像における原子骨格の歪みを解析できる事を特色とする。		
発明の効果	本発明によれば、錯体試料の一部または全体をコリン系イオン液体あるいはコリン系イオン液体と溶媒との混合液で覆った状態で透過型電子顕微鏡により観察するので、電子線を照射した場合にイオン液体が導電性を確保し、帯電によるチャージアップを起こすことなく錯体試料の観察ができる。また、イオン液体は真空中でも殆ど揮発しないので、透過型電子顕微鏡観察する場合の真空環境であってもイオン液体で錯体試料を確実に保護することができ、結晶内部に結晶水を含む錯体試料であっても結晶水を蒸発させることなく観察できる。よって、透過型電子顕微鏡による錯体の構造解析ができる。		
技術分野	金属・材料		
キーワード	金属錯体, イオン液体, 電子顕微鏡		
国際特許分類	G01N 1/28	H01J 37/20	



【問い合わせ先】

日本大学産官学連携知財センター (NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南 4 - 8 - 2 4 日本大学会館

TEL : 03-5275-8139 FAX : 03-5275-8328 E-mail : nubic@nihon-u.ac.jp